



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و  
فوتوونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس  
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،  
دانشگاه سیستان و بلوچستان،  
 Zahedan, Iran.  
 ۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹



کد مقاله : A-۱۰-۲۶۰ ۴-۱

## بررسی گاف‌های فرکانسی بلورهای فوتونی پلاسمایی یک بعدی تئو-مورس

محبوبه قلندری<sup>۱</sup>، مليحه نجاتی<sup>۲</sup> و مهدی سلیمانی<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>گروه فیزیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم

<sup>۲</sup>گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده - در این کار، به بررسی گاف‌های فرکانسی تعدادی از بلورهای فوتونی با چینش دی الکتریک/پلاسمای خواهیم پرداخت. ترتیب قرارگیری لایه‌ها از دنباله تئو-مورس تعیین می‌کنند. با استفاده از روش مرسم ماتریس انتقال، نمودار ضریب عبور بر حسب فرکانس موج فرودی را می‌یابیم و از روی آن گاف‌های فرکانسی را بدست می‌آوریم.

کلید واژه - بلور فوتونی پلاسمایی، دنباله تئو-مورس - روش ماتریس انتقال - گاف فرکانسی

## Investigation of frequency gaps of the one dimensional Thue-Morse plasma photonic crystals

Mahboubeh Ghalandari<sup>1</sup>, Maliheh Nejati<sup>2</sup> and Mehdi Solaimani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Physics, Faculty of Mechanical Engineering, Qom University of Technology, Qom

<sup>2</sup>Department of Physics, Faculty of science, Qom University, Qom

[ma.nejati@qom.ac.ir](mailto:ma.nejati@qom.ac.ir), [solaimani @qut.ac.ir](mailto:solaimani @qut.ac.ir), [mahboubeh.ghalandari@gmail.com](mailto:mahboubeh.ghalandari@gmail.com)

**Abstract-** In this work, we will study the frequency gaps of a few plasma/dielectric photonic crystals. The arrangement of the layers obeys from the Thue-Morse sequence. We obtain the diagrams of the transmission coefficient with respect to the incident wave frequency through the conventional transfer matrix method and using them we evaluate the frequency gaps.

Keywords: Plasma photonic crystals, Thue-Morse sequence, transfer matrix method, frequency gaps.

پیروی می نماید.  $m$  جرم الکترون و  $e$  بار الکترون می باشد. در این مقاله با استفاده از روش ماتریس انتقال به محاسبه ضرایب عبور می پردازیم [۲]. ماتریس انتقال  $M$  برای مد  $TM$  در زاویه فروودی  $\theta_0$  از خلا به داخل ساختار به صورت زیر داده می شود:

$$M[d] = \prod_{i=1,2} \begin{bmatrix} \cos(\gamma_i) & -i \sin(\gamma_i) \\ -ip_i \sin(\gamma_i) & \cos(\gamma_i) \end{bmatrix} \quad (1)$$

که  $\gamma_i = (\omega/c) n_i d_i \cos(\theta_i)$ ،  $c$  سرعت نور در خلا و  $\theta_i$  زاویه شکست در لایه با ضریب شکست  $n_i$  است. در اینجا  $p_i = \sqrt{\mu_i / \epsilon_i} \cos \theta_i$  است که در آن  $\cos \theta_j = \sqrt{1 - (n_0^2 \sin^2 \theta_0 / n_j^2)}$ . بنابراین، ماتریس انتقال برای یک ساختار  $N$  دوره ای برابر  $[M(d)]^N$  است. ضریب عبور برای کل سیستم به صورت زیر می باشد:

$$t = \frac{2p_0}{(M_{11} + M_{12}p_s)p_0 + (M_{21} + M_{22}p_s)} \quad (2)$$

در این رابطه،  $M_{ij}$  با فرض  $(i, j = 1, 2)$  عناصر ماتریس  $[M(d)]^N$  هستند. همچنین داریم:  $p_0 = \cos \theta_0 / n_0$  و

$$p_s = \cos \theta_s / n_s$$

## نتایج عددی

در این مقاله، فرض کردہ ایم که چگالی پلاسمای  $n_e$  برابر  $1 \times 10^{18} m^{-3}$  و طول سیستم  $L$  برابر  $30 mm$  می باشد. همچنین برای این که رفتار ضریب عبور بر حسب فرکانس را به ازای ثابت های دی الکتریک مختلف مورد بررسی قرار دهیم، ثابت دی الکتریک را از ۷ تا ۲۵ تغییر داده و نتایج عددی حاصل از آن را به ازای ۳ تعداد چهار متفاوت در شکل های ۱ تا ۳ ترسیم کردہ ایم. در شکل ۱، نمودار تغییرات ضریب عبور بر حسب فرکانس به ازای  $wellnumber=10$  می باشد که این شکل نشان می دهد ترسیم شده است. همان طور که این شکل نشان می دهد در ناحیه فرکانس های مختلف، گاف های متعددی مشاهده می شود. در این کار به دنبال بررسی اثر ثابت دی الکتریک بر روی پهنه ای گاف می باشیم. از آن جا که اولین گاف در این نمودارها رفتار خیلی واضحی از خود نشان

## مقدمه

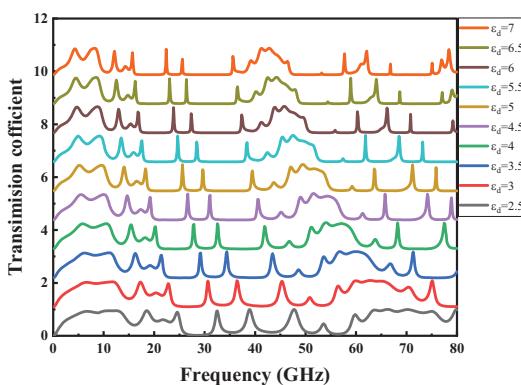
در مدل تئو-مورس، ساختار کاملا از دیگر سیستم های شبه دوره ای متفاوت است. این ساختار یک حالت بین حالات تصادفی و شبه دوره ای است. در این ساختارها طیف دامنه فوریه قله های به شکل تابع دلتا ندارد، بلکه طیف دامنه فوریه این ساختارها مشکل از قله های تابع دلتا و طیف پیوسته تکین است [۳]. این مدل تاکنون در حوزه های مختلفی نظریه مدل آیزنگ [۴]، ویژگی های فونونی [۵]، گسیل خودبخودی [۶]، فوتولومینسانس اکسایتونی [۷]، ویژگی های جایگزیدگی [۸] و ....

در این مطالعه، به بررسی گاف های نواری چند لایه ای هایی با چینش تئو-مورس خواهیم پرداخت. در این ساختارها طول کلی را ثابت نگه خواهیم داشت تا اندازه ساختار خیلی بزرگ نشود. همچنین، از روش ماتریس انتقال برای حل مسئله استفاده خواهیم کرد.

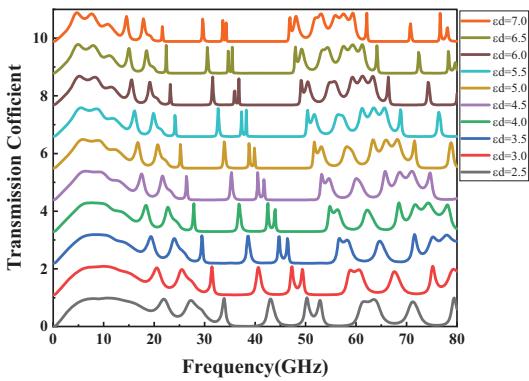
## فرمالمیزم

در این مقاله، یک بلور فوتونی یک بعدی را در نظر می گیریم که طول کل آن ثابت است. ساختار این بلور فوتونی مبتنی بر تابع تئو-مورس<sup>۱</sup> است که به صورت تکه ای تغییر می کند. با استفاده از دو علامت مختلف  $A$  و  $B$  برای تولید  $n$  امین نسل تئو-مورس  $S_n$  استفاده می کنیم [۱]:  $S_n = S_{n-1} + S_{n-1}$  که  $S_n = AB$  می تواند با معاوضه ای  $A$  و  $B$  در  $S_{n-1}$  تولید شود. برای مثال،  $S_3 = ABBABAAB$ ،  $S_2 = ABBA$  و ... در این مقاله، فرض می کنیم که بلور فوتونی شاملدو لایه دی الکتریک و پلاسما است که به طور تناوبی تکرار می شود. ضریب شکست پلاسما بصورت  $n_p = (1 - \omega_p^2 / \omega^2)^{1/2}$  می باشد که در آن فرکانس پلاسما از رابطه  $\omega_p = (n_e e^2 / m \epsilon_0)^{1/2}$

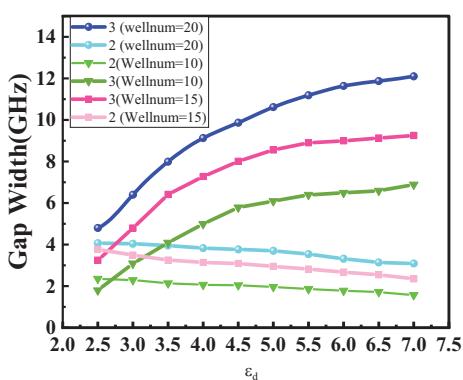
<sup>۱</sup>Thue-Morse



شکل ۲: نمودار ضریب عبور بر حسب فرکانس موج فرودی به ازای  $\text{wellnumber} = 15, n_e = 1 \times 10^{18} m^{-3}$ ،  $L = 30 mm$  و تغییر ضریب دی الکتریک  $\epsilon_d$  از ۲.۵ تا ۷.

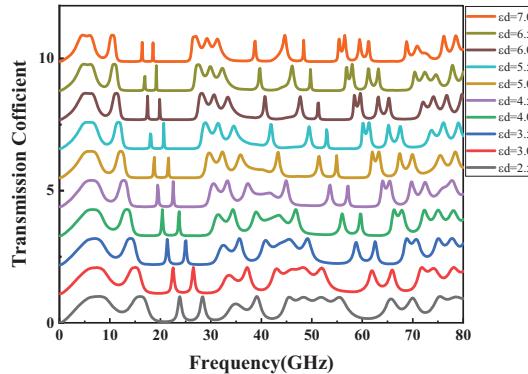


شکل ۳: نمودار ضریب عبور بر حسب فرکانس موج فرودی به ازای  $\text{wellnumber} = 20, n_e = 1 \times 10^{18} m^{-3}$ ،  $L = 30 mm$  و تغییر ضریب دی الکتریک  $\epsilon_d$  از ۲.۵ تا ۷.



شکل ۴: نمودار تغییر عرض گاف‌های بلور فوتونی بر حسب تغییرات ضریب دی الکتریک به ازای  $n_e = 1 \times 10^{18} m^{-3}, L = 30 mm$  و  $\text{wellnumber} = 10, 15, 20$

نمی‌داد. لذا پهنهای گاف دوم و سوم را با تغییر ثابت دی الکتریک در شکل ۴، مورد بررسی قرار دادیم. در این شکل، عرض گاف دوم برای تعداد چاههای ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ترسیم شده است. همان‌طور که این شکل نشان می‌دهد با افزایش ثابت دی الکتریک، پهنهای گاف دوم به آرامی کاهش می‌یابد. اما بررسی پهنهای گاف سوم به ازای تعداد چاههای متفاوت نشان می‌دهد که به ازای تمام تعداد چاههای پهنهای گاف با افزایش ثابت دی‌اکتریک افزایش می‌یابد. این تغییرات منظم در پهنهای گاف نشان می‌دهد، بدون این که فرکانس پلاسمایی یا طول سیستم را تغییر دهیم، می‌توانیم محل و عرض گاف را تنظیم کنیم. نکته دیگر آن است که، رفتار گاف دوم بصورت خطی و گاف سوم بصورت منحنی است. همچنین در شکل‌های ۱ تا ۳ مشاهده می‌کنیم که با افزایش ثابت دی‌الکتریک، محل گاف‌های فرکانسی به سمت فرکانس‌های کمتر شیفت پیدا می‌کند.



شکل ۱: نمودار ضریب عبور بر حسب فرکانس موج فرودی به ازای  $\text{wellnumber} = 10, n_e = 1 \times 10^{18} m^{-3}$ ،  $L = 30 mm$  و تغییر ضریب دی الکتریک  $\epsilon_d$  از ۲.۵ تا ۷.

## نتیجه‌گیری

در این مطالعه، گاف‌های فرکانسی تعدادی بلور فوتونی پلاسمایی یک بعدی با توالی ثئو-مورس مورد بررسی قرار گرفت. با کمک روش ماتریس انتقال این گاف‌ها بدست آمدند. نشان داده شد که با افزایش ثابت دیالکتریک، پهنهای برخی از گاف‌ها کاهش می‌یابد. تغییرات در پهنهای گاف فرکانسی نشان داد که بدون این‌که فرکانس پلاسمایی یا طول سیستم را تغییر دهیم، می‌توانیم محل و عرض گاف را تنظیم کنیم. با افزایش ثابت دیالکتریک نیز محل گاف‌های فرکانسی به سمت فرکانس‌های کمتر شیفت پیدا کرد.

## مراجع

- [1] V. Ferrando, A. Coves, P. Andres, and J. A. Monsoriu, "Guiding Properties of a Photonic Quasi-Crystal Fiber Based on the Thue-Morse Sequence", *IEEE Photonics Technology Letters*, Vol. 27, pp. 1903-1906, 2015.
- [2] M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics: Electromagnetic theory of propagation, Interference and diffraction of light*, Cambridge University Press, 2005.
- [3] L. Wang, X. Yang, T. Chen, "Second harmonic generation in generalized Thue-Morse ferroelectric superlattices", *Physica B* Vol. 404, pp. 3425–3430, 2009.
- [4] Z. Lin and R. Tao, "Quantum Ising model on Thue-Morse aperiodic chain", *Phys. Lett. A* Vol. 150, pp. 11-13, 1990.
- [5] E. M. Pan, Z. K. Jiao, G. J. Jin, A. Hub, S. S. Jiang, "Phonon properties of W/Ti Thue-Morse superlattices", *Phys. Lett. A* Vol. 245, pp. 483-488, 1998.
- [6] L. Li, C. J. Mathai, S. Gangopadhyay, X. Yang & J. Gao, "Spontaneous emission rate enhancement with aperiodic Thue-Morse multilayer", *Sci. Rep.* Vol. 9, p. 8473, 2019.
- [7] W. J. Hsueh, C. H. Chang, and C. T. Lin, "Exciton photoluminescence in resonant quasi-periodic Thue-Morse quantum wells", *Opt. Lett.* Vol. 39, pp. 489-492, 2014.
- [8] E. Lazo, E. Saavedra, F. Humire, C. Castro, and F. Cortes-Cortes, "Localization properties of transmission lines with generalized Thue-Morse distribution of inductances", *Eur. Phys. J. B* Vol. 88, p. 216, (2015).